

Metrologie in der Mikro- und Nanotechnik 2011

Veranstaltung - Metrologie in der Mikro- und Nanotechnik 2011

Titel	Metrologie in der Mikro- und Nanotechnik 2011
Wann	Di, 25. Oktober 2011 - Mi, 26. Oktober 2011

Beschreibung

Metrologie in der Mikro- und Nanotechnik 2011

Hochkarätige Experten aus Industrie und Wissenschaft geben auf der 4. Fachtagung einen Einblick in den aktuellen Stand von Messprinzipien, Grundlagen und Anwendungen im Bereich der Mikro- und Nanotechnologie. Diskutiert werden neben den bestehenden Möglichkeiten der Technologien auch die zukünftigen Entwicklungspotenziale.

Zu folgenden Themen werden Vorträge gehalten:

- Nanomess- und Positioniertechnik
- Erfassung Oberflächen und Volumen (taktile, optische, Rastersonden, CT)
- Auswertung (Normen-Richtlinien, Modellierung)
- Rückführung
- Anwendungen

Weitere Informationen finden Sie direkt bei dem Veranstalter unter folgendem Link:

[http://www.vdi-wissensforum.de/index.php?id=102&user_vdiev_pi1\[cmd\]=single&user_vdiev_pi1\[uid\]=01TA702011&no_cache=1](http://www.vdi-wissensforum.de/index.php?id=102&user_vdiev_pi1[cmd]=single&user_vdiev_pi1[uid]=01TA702011&no_cache=1)

Lokalität - Erlangen

Standort	Erlangen
Ortsname	Erlangen
Land	DE